

Сканирующий электронный микроскоп

Получение изображения поверхности объекта с высоким разрешением, а также информации о химическом составе поверхностного слоя



АННОТАЦИЯ

Сканирующий электронный микроскоп позволяет получать изображения поверхности объекта с высоким разрешением. Высокая разрешающая способность обеспечивается за счет использования сфокусированного потока электронов для построения изображения.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Биология
- Медицина
- Геология
- Материаловедение
- Промышленность
- Криминалистика

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкая цена в сравнении с иностранными аналогами
- Первая отечественная разработка сканирующего микроскопа

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

Разработка макета устройства

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ускоряющее напряжение – 15 кВ
- Разрешение – до 1 мкм
- Степень увеличения: до 1000х
- Система детектирования: BSE-детектор, SE-детектор
- Вакуумная система: полностью автоматическая вакуумная система
- Вес устройства: не более 150 кг.
- Габариты устройства: не более 700х500х800 мм



Макет электронного сканирующего микроскопа

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024684967

«Программа управления макетом сканирующего электронного микроскопа («EMControl»))»





СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

***Больше научно-технических разработок
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на сайте***



***Сайт: ctt.etu.ru E-mail: ctt@etu.ru
Телефон: +7(812) 234-24-84
197022, Россия, Санкт-Петербург
ул. Профессора Попова, д.5 литера Ф***

НАУКА
И УНИВЕРСИТЕТЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ